

电子产品跌落测试标准有这些

产品名称	电子产品跌落测试标准有这些
公司名称	深圳市环测威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	环测威:跌落测试 跌落测试:电子产品跌落测试
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707-283 15811815782

产品详情

电子产品跌落测试标准，自由跌落试验的检测标准如下：

电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落GB/T 2423.8-1995/IEC60068-2-32：1990

包装运输包装件跌落试验方法GB/T 4857.5-1992/ISO 2248：1985

包装运输包装件编制性能试验大纲的定量数据 GB/T 4857.18-1992/ISO 4180-2：1980

星用通信设备通用规范GJB367A-2001

星用计算机通用规范GJB322A-1998

星用电子测试设备通用规范GJB3947A-2009

电子测量仪器通用规范GB/T 6587-2012

自由跌落试验GB2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ed：自由跌落本试验分为两种方法.第一种方法通常是用来模拟非包装的产品在搬运期间可能经受到的自由跌落，样品通常是按照规定的状态从规定的高度跌落到规定的表面上两次.第二种方法通常是用来模拟附在电缆上的连接器小型遥控装置等在使用中可能经受的重复自由跌落.使试验样品从规定高度重复跌落到规定的表面上。

自由跌落

试验的目的：确定在搬运期间由于粗率装卸遭到跌落的适应性，或确定安全要求的最低牢固等级.

本试验主要用于非包装的试验样品，以及在运输箱中包装可以作为样品一部分的试验样品.

试验条件：

试验表面：试验表面应该是混凝土或钢制成的平滑，坚硬的刚性表面。必要时，有关规范可以规定其他表面。

跌落高度：是指试验样品在跌落前悬挂着的时候，试验表面与离它最近的样品部位之间的高度。

释放方法：释放试验样品的方法应使试验样品从悬挂着的位置自由跌落。释放时，要使干扰最小。

跌落的高度：25mm，50mm，100mm，250mm，500mm，1000mm。